

Таблица S1.

Дополнительные сведения об использованных для исследования приборах

№ п/п	Название прибора, фирма изготовитель	Год выпуска	Погрешность
1	Атомно-эмиссионный спектрометр IRIS Intrepid II XSP Duo “Thermo Electron Corporation”, USA	2006	Относительное СКО случайной составляющей погрешности спектрометра менее 2.0%
2	Электронные весы WAA 60/160/X “RADWAG”, Польша	2006	0.0001 мг
3	Муфельная печь Instrumental of Laboratory, Mod 550–14, “Fisher Scientific”, Канада	2005	0.1°C
4	ЯМР спектрометр BRUKER AVANCE ^{II} /400, Германия	2007	¹ H 0.001 м.д.; ¹³ C 0.01 м.д.
5	Спектрофотометр Helios Gamma “Thermo Electron Corporation”, Англия	2003	2 нм
6	Инфракрасный Фурье спектрометр Bruker Vertex 70	2004	0.01 см ⁻¹
7	Рентгеновский дифрактометр ДРОН–3.0 “Буревестник”, Россия	1985	0.01 град
8	Анализатор “STA 449 F1 Jupiter”	2008	0.025мкг
9	Измеритель LCR DE–5000 DER EE Electrical Instruments, Тайвань	2012	0.2 Ом